附件：

会议审定的标准项目

| 序号 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 起草单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国标委发[2022]43号W20222916 | 硅片表面光泽度的测试方法（外文版） | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2022]43号W20222917 | 碳化硅外延层厚度的测试 红外反射法（外文版） | 安徽长飞先进半导体有限公司 | 审定 |